

NANOMETRO 半导体高效量测系统

NANOMETRO SMART SEMI METROLOGY

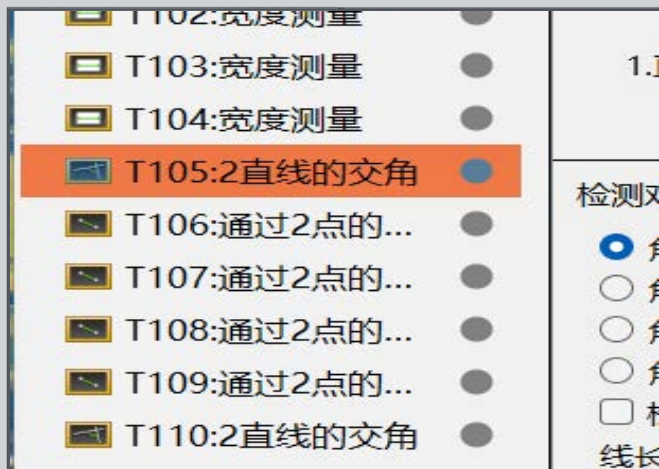
产品简介

NANOMETRO SMART 半导体高效量测系统是一款专为半导体工艺中关键尺寸快速精准量测而设计的软件，本量测软件包含三个主要特色，能够帮助用户快速、准确地进行半导体的量测，帮助用户更好地掌握芯片制造过程中的关键尺寸参数。

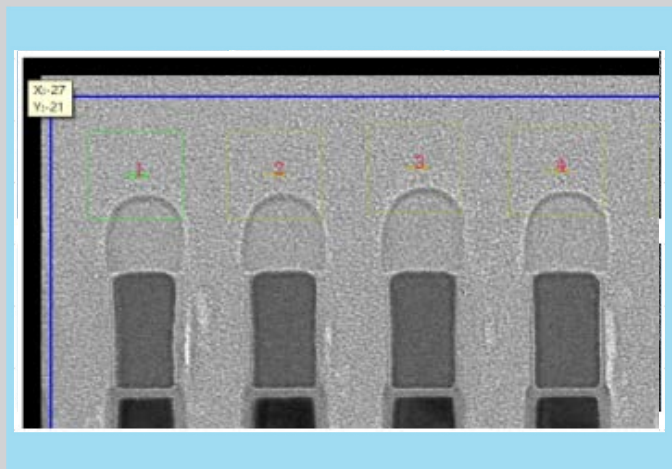
产品特点

1. 丰富的图像预处理功能：

NANOMETRO SMART 半导体高效量测系统内置了丰富的预处理和滤波模型，这些模型可以直接调用和修改，让用户能够更加灵活地进行数据处理，从而得到更加准确的量测结果。



NANOMETRO SMART 内置丰富的图像处理模块



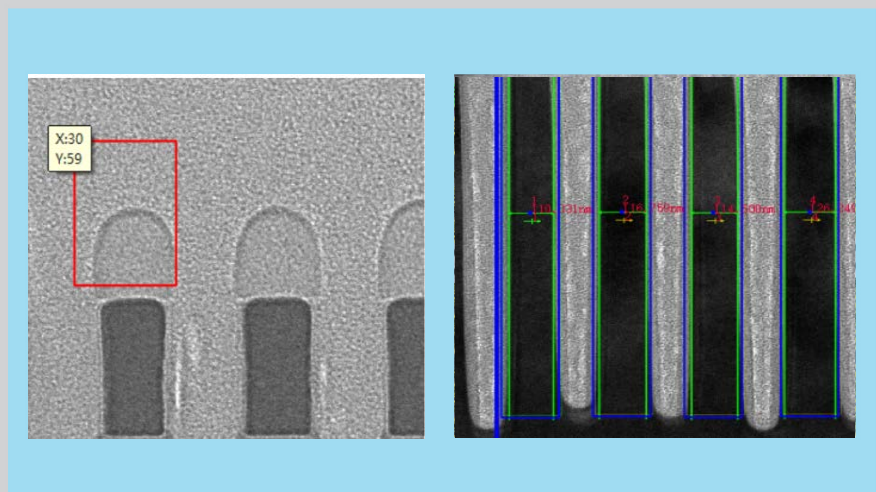
NANOMETRO SMART 系统针对图像滤波处理

2. 丰富的量测工具

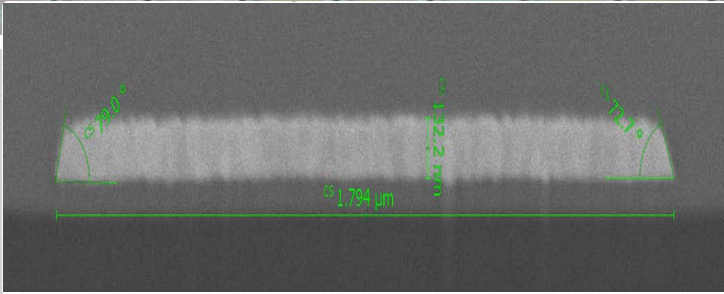
NANOMETRO快速量测系统全面的针对于半导体工艺的量测工具和模块，这些工具和模块能够快速验证和调用，让用户能够更加方便和迅捷地完成繁复的尺寸量测任务。



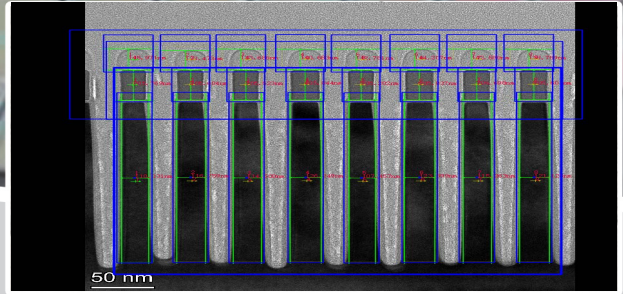
NANOMETRO SMART 内置丰富的量测工具



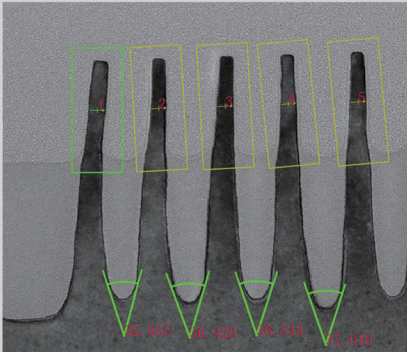
目标结构快速定位



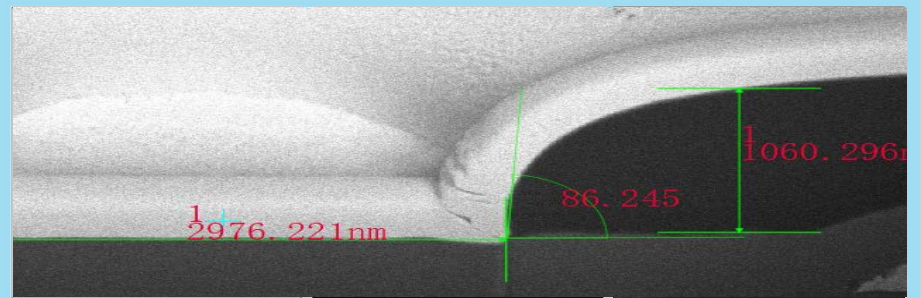
边缘精准检测



关键尺寸快速量测结果示例



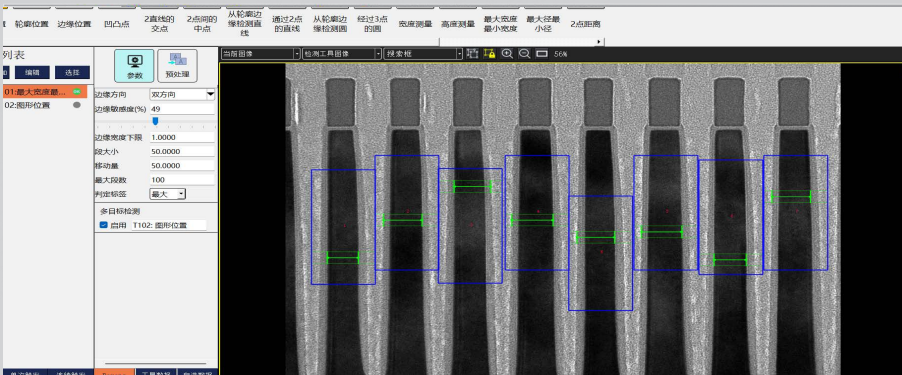
关键角度快速量测



更多自动量测结果示例

3. 简洁的界面与流程编辑操作:

NANOMETRO SMART 系统界面简洁、直观，操作简单，内置易于使用的模块编辑器，避免代码编写就能实现自动寻边，自动关键位置锁定，及自动坐标位置补偿等复杂图像运算，从而可以高效地完成实FA实验室日常繁复的图像分析和量测任务。



NANOMETRO SMART 系统量测界面示例



NANOMETRO SMART 系统工具编辑界面示例

除此之外，我们还拥有丰富的客户端经验和案例，可以与用户分享，帮助用户更好地了解我们的产品和服务。

如果您正在寻找一款高效、准确、易于使用的半导体自动量测软件，那么我们的产品将是您的不二选择。